Нанокристаллитная природа высокосимметричных Ce⁴⁺-Eu³⁺-центров в кварцевых гель-стеклах

© Г.Е. Малашкевич, В.Н. Сигаев*, Г.И. Семкова, Б. Шампаньон**

Институт молекулярной и атомной физики Национальной академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия * Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125190 Москва, Россия ** University of Lyon-1, 69622 Villeurbanne cedex Lyon, France E-mail: malash@imaph.bas-net.by (Поступила в Редакцию 10 апреля 2003 г.

В окончательной редакции 24 июля 2003 г.)

На основе исследования спектрально-люминесцентных свойств кварцевых гель-стекол, соактивированных ионами Ce⁴⁺ и Eu³⁺, а также данных рентгенофазового анализа и малоуглового рассеяния нейтронов сделан вывод о нанокристаллитной природе формирующихся в них сложных Ce⁴⁺–Eu³⁺-центров с высокосимметричными оксокомплексами Eu(III). Такие центры характеризуются низкой эффективностью электронно-колебательного взаимодействия ионов Eu³⁺ с матрицей, а диаметр соответствующих кристаллитов при используемых условиях синтеза и концентрациях соактиваторов составляет ~ 10 nm.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант № Ф02Р-003), Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 02-03-81002) и программы НАТО "Наука — миру"(грант N SfP 977980).

Как известно [1-3], соактивация Ln³⁺-содержащих кварцевых гель-стекол ионами Се4+ может сопровождаться образованием двух типов сложных Се⁴⁺-Ln³⁺-оптических центров, один из которых характеризуется высокой, а второй — низкой симметрией входящих в них оксокомплексов Ln(III). При этом характер спектров люминесценции высокосимметричных оксокомплексов, как правило, более типичен для кристаллических матриц, чем для стеклообразных, хотя кристаллическая фаза в слаболегированных образцах не выявлена. Этот факт с учетом обнаруженного ослабления кросс-релаксационного тушения люминесценции ионов Nd³⁺ для высокосимметричных $Ce^{4+}-Nd^{3+}$ -центров [3] дает основание предположить, что такие центры представляют собой оксидные наночастицы, в которых ионы Ln³⁺ окружены оксокомплексами Ce(IV). Однако, в целом процесс образования подобных центров изучен явно недостаточно. Более того, наличие нанонеоднородностей в рассматриваемых стеклах не было подтверждено прямыми структурными методами. Восполнение этого пробела — цель настоящей работы.

Материалы и методика эксперимента

Опытные образцы получены путем прямого перехода "золь-гель-стекло" по методу, описанному в [4]. Активация осуществлялась пропиткой пористых ксерогелей растворами хлоридов церия и европия с различной концентрацией *C*. Спекание ксерогелей до состояния прозрачного стекла проводилось на воздухе при $T = 1250^{\circ}$ С и идентичных температурно-временных условиях. Все реактивы имели квалификацию ОСЧ.

Спектры люминесценции (СЛ) и ее возбуждения (СВЛ) регистрировались на спектрофлуориметре СДЛ-2, исправлялись с учетом спектральной чувствительности системы регистрации и распределения спектральной плотности возбуждающего излучения соответственно, приводились к единице в максимуме и представлялись в виде зависимости числа квантов на единичный интервал длин волн $dn/d\lambda$ от λ . Разложение сложных спектральных полос на индивидуальные составляющие и определение их барицентров осуществлялось известными методами компьютерной обработки.

Наличие в стеклах кристаллических фаз контролировалось с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-2.0 ($\lambda = 1.54184 \text{ nm}$). Субмикроскопическое строение стекол исследовалось методом малоуглового рассейния нейтронов (МУРН). Зависимость интенсивности рассеяния I от вектора рассеяния $q = 4\pi \sin \Theta / \lambda$ [5] исследовалась в диапазоне $0.01 < q < 0.3 \,\text{\AA}^{-1}$ на дифрактометре D11 высокопоточного атомного реактора Института Лауэ-Ланжевена в Гренобле. Размеры неоднородностей оценивались в приближении Гинье [6] (по наклону прямолинейного участка кривой МУРН в координатах $\ln I - q^2$ в области малых q в предположении о статистически равномерном распределении частиц сферической формы в однородной матрице). Используемые образцы представляли собой диски диаметром примерно 15 и толщиной 10 mm.

2. Результаты

На рис. 1 приведены СЛ (а) и СВЛ (b) низко-(кривые 1, 3) и высокосимметричных (кривые 2, 4) Ce^{4+} -Eu³⁺-центров в области переходов ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_i$ в исследованном стекле с $C_{\text{CeCl}_3} = 2$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 1$ mass%. Полуширины полос возбуждения $\Delta \lambda_{exc}$ и регистрации Δλ_{reg} составляли для обзорных спектров соответственно 3 и 1.0 nm, T = 298 K. На вставках представлены СЛ этих оптических центров в области нерасщепляющейся $^{5}D_{0} \rightarrow ^{7}F_{0}$ -полосы, приведенные в максимуме к единице и записанные с высоким разрешением ($\Delta \lambda_{exc} = 1$ и $\Delta \lambda_{\text{reg}} = 0.3 \,\text{nm}$) при $T = 77 \,\text{K}$, и их СВЛ в области электронно-колебательной компоненты перехода ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{2}$, записанные в увеличенном масштабе при $T = 298 \,\mathrm{K} \,$ ($\Delta \lambda_{\mathrm{exc}} = 3 \,$ и $\Delta \lambda_{\mathrm{reg}} = 1 \,\mathrm{nm}$). Как видно, при переходе от низкосимметричных центров, возбуждаемых в f-f-полосах ионов Eu³⁺ (кривая *1*, $\lambda_{exc} = 395$ nm), к высокосимметричным, возбуждаемым через сенсибилизатор (кривая 2, $\lambda_{exc} = 320$ nm), имеет место не только значительное снижение коэффициента ветвления люминесценции в электродипольных переходах, но и многократное сужение полосы ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0}$. При регистрации



Рис. 1. Спектры люминесценции (*a*) и ее возбуждения (*b*) Се⁴⁺–Еu³⁺-центров в кварцевом стекле с $C_{\text{CeCl}_3} = 2$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 1 \text{ mass}\%$. λ_{exc} , nm: 320 (*2*) и 395 (*I*). λ_{reg} , nm: 591 (*4*) и 615 (*3*). $\Delta \lambda_{\text{exc}}$, nm: 1 (вставка *a*) и 3 (обзорные спектры и вставка *b*). $\Delta \lambda_{\text{reg}}$, nm: 0.3 (вставка *a*) и 1 (обзорные спектры и вставка *b*). T = 77 (вставка *a*) и 298 К (обзорные спектры и вставка *b*).



Рис. 2. Дифрактограммы Се–Еи-содержащих кварцевых гель-стекол с $C_{\text{CeCl}_3} = 2$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 1 \text{ mass}\%$ (*a*), $C_{\text{CeCl}_3} = 6$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 0.6 \text{ mass}\%$ (*b*).

люминесценции на длине волны $\lambda_{reg} = 617$ nm, т.е. в области максимального отношения интенсивности в спектре низкосиметричных центров к интенсивности в спектре высокосимметричных, в СВЛ наблюдается достаточно интенсивная электронно-колебательная компонента при $\lambda \sim 440$ nm (кривая 3, см. вставку). При регистрации в области максимальной интенсивности люминесценции высокосимметричных центров ($\lambda_{reg} = 591$ nm) эта компонента не обнаруживается (кривая 4).

На рис. 2 приведены дифрактограммы Ce–Euсодержащих кварцевых гель-стекол с $C_{CeCl_3} = 2$ и $C_{EuCl_3} = 1 \text{ mass}\%$ (*a*) и $C_{CeCl_3} = 6$ и $C_{EuCl_3} = 0.6 \text{ mass}\%$ (*b*). Как видно, стекло с малой концентрацией соактиваторов характеризуется наличием размытых, но достаточно явных полос при углах $2\theta \approx 28$, 47 и 56°, а также признаками полосы при $2\theta \approx 33^\circ$. Для высокоактивированного стекла наблюдается существенное увеличение интенсивности и сужение этих полос, а также появление в несколько раз более слабых полос при $2\theta \approx 59.0$, 69.2, 76.5, 78.9, 88.2 и 95.2° (на рис. 2 не показаны). Дифрактограммы неактивированных стекол каких-либо признаков наличия кристаллических образований не обнаруживают.

На рис. З приведены кривые МУРН неактивированного кварцевого гель-стекла (кривая 1) и стекла с $C_{\text{CeCl}_3} = 2$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 1 \text{ mass}\%$ (кривая 2). Как видно, для неактивированнго стекла интенсивность МУРН не зависит от q (стекло однородно на наномасштабе), а соактивированное стекло содержит наноразмерные неоднородности. Кривыми МУРН, подобными кривой 2,



Рис. 3. Зависимость интенсивности малоуглового рассеяния нейтронов от вектора рассеяния для неактивированного кварцевого гель-стекла (*I*) и Се–Еи-содержащего стекла с $C_{\text{CeCl}_3} = 2$ и $C_{\text{EuCl}_3} = 1 \text{ mass}\%$ (*2*).

характеризуются и однолегированные церием стекла. Следует отметить, что варьирование температурновременных условий синтеза, а также техники легирования и концентрации активатора сопровождается заметными изменениями угла наклона линейного участка кривой МУРН в координатах $\ln I - q^2$.

3. Обсуждение результатов

Одним из ключевых моментов в решении поставленной задачи — выяснении природы высокосимметричных Се⁴⁺-Еи³⁺-центров — является анализ СЛ и СВЛ, приведенных на вставках рис. 1. В первую очередь обращает на себя внимание многократное уменьшение полуширины полосы ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0}$ ионов Eu $^{3+}$ при переходе от низкосимметричных центров к высокосимметричным. Реализуемое для последних значение $\Delta \lambda$ указанной полосы составляет 1.0 nm ($\Delta \tilde{\nu} \sim 30 \, {\rm cm}^{-1}$), т.е. близко к полуширине одноименной полосы в оксидах ($\sim 30\,{
m cm^{-1}}$ для основного типа центров при T = 298 K) [7], и в 3 раза меньше полуширины, характерной для Еи-содержащих кварцевых гель-стекол при селективном лазерном возбуждении и $T = 77 \, \text{K}$ [8]. Это может служить весомым аргументом в пользу нанокристаллитной природы высокосимметричных центров, тем более, что в случае малых размеров таких кристаллитов доля их "поверхностных" ионов и соответственно неоднородное уширение будет существенно выше, чем в порошках оксидов. Кроме того, реальная полуширина полосы ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0}$ для высокосимметричных центров может оказаться существенно уже наблюдаемой в нашем эксперименте, так как весьма слабая интенсивность этой полосы из-за уменьшения эффективности возбуждения рассматриваемых центров

с понижением T^1 не позволила использовать более высокое спектральное разрешение. Вторым аргументом в пользу нанокристалличности высокосимметричных центров является отсутствие в их СВЛ выраженной электронно-колебательной компоненты перехода ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}D_{2}$ (ср. кривые 3 и 4). Вычисление энергетического интервала между барицентрами соответствующих полос на кривой 3 дает величину $\tilde{\nu} \approx 1080 \,\mathrm{cm}^{-1}$, которая близка к волновому числу валентных колебаний мостиков Si-O-Si [9]. Исчезновение этой компоненты при переходе от сложных центров с низкой симметрией оксокомплексов Eu(III) к центрам с высокой симметрией свидетельствует о вытеснении структурных элементов матрицы за пределы высокосимметричных центров. В таком случае низкую симметрию центров второго типа, не сформировавшихся в оксидные наночастицы, можно связать с возмущающим влиянием единичных ионов Се⁴⁺, внедрившихся в первую катионную оболочку изолированных ионов Eu³⁺. Как отмечалось ранее [2], ионы Се⁴⁺ могут выполнять роль буферных элементов, способствующих вхождению в кремнекислородный каркас высококоординированных ионов Ln³⁺. В пользу такой роли свидетельствует и отсутствие в СВЛ низкосимметричных Ce⁴⁺-Eu³⁺-центров явного проявления электронно-колебательной компоненты, соответствующей колебанию связей Si–O⁻ ($\tilde{\nu} \approx 910 \, \mathrm{cm}^{-1}$) и характерной для химических кластеров Eu-O, реализующихся в Еи-содержащем кварцевом гель-стекле [8,10]. Поэтому образование изолированных низкосиммеричных Ce⁴⁺-Eu³⁺-центров представляется вполне закономеным.

Согласно [11], двуокись церия имеет кубическую решетку с пространственной группой симметрии $O_{h}^{5} - Fm3m$, где координационное число катионов равно 8. В [2] показано, что в высокосимметричных сложных центрах ионы Eu³⁺ также формируют полиэдры [EuO₈] кубической симметрии. Это дает основание предполагать, что такие центры образуются при замещении церия в наночастицах СеО2 ионами трехзарядного европия. Поскольку радиус последних на 18% больше радиуса Се⁴⁺ [12], при таком замещении структурный каркас наночастицы сдавливает оксокомплекс Eu(III) и степень ковалентности связи Eu-O должна повыситься. По-видимому, именно этим обстоятельством и объясняется значительный сдвиг в длинноволновую область, приблизительно на 4 nm $(120 \, \text{cm}^{-1})$, положения барицентра полосы ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0}$ ($\bar{\lambda} \sim 580 \,\mathrm{nm}$) в СЛ (рис. 1, *a*) для высокосимметричных сложных центров по сравнению с низкосимметричными. Можно также полагать, что из-за отсутствия в исследованных стеклах щелочных и щелочноземельных элементов замещение Се4+ на Eu³⁺ осуществляется без локальной компенсации заряда благодаря сохранению симметрии поля лигандов в жесткой кремнекислородной матрице при изменении валентного состояния редкоземельного активатора и

¹ Причины данного эффекта будут проанализированы в отдельной работе.

возможности общей зарядовой компенсации дефектами этой матрицы [13].

Анализ дифрактограмм Се-Еи-содержащего стекла (рис. 2) показывает наличие кристаллической фазы как в слаболегированных, так и в высоколегированных образцах. Согласно данным каталога JCPDS-1998, брэгговские отражения при углах 2θ , равных 28.55, 33.10, 47.48, 56.34, 59.09, 62.42, 76.70, 79.08, 88.43 и 95.41° с относительной интенсивностью 1.0, 0.27, 0.46, 0.34, 0.06, 0.06, 0.12, 0.07, 0.10 и 0.09, соответствуют кубической кристаллической решетке СеО₂ с простанственной группой Fm3m. Сравнение этих данных с положением и интенсивностью узких полос на приведенных дифрактораммах свидетельствует об их достаточно хорошем совпадении. Из общих соображений можно заключить, что содержание кристаллической фазы уже в слаболегированном образце составляет не менее 5%, а размеры кристаллитов, судя по ширине дифракционных полос на рис. 2, а и отсутствию опалесценции, много меньше 1 µm. Данные результаты подкрепляют сделанное выше предположение о формировании высокосимметричных Ce⁴⁺-Eu³⁺-центров путем замещения церия европием в наночастицах СеО2 в части наличия необходимой для этого предпосылки — существовании таких наночастиц.

Прямым подтверждением наличия нанонеоднородностей в Се–Еи-содержащих стеклах является зависимость интенсивности МУРН от q (кривая 2 на рис. 3). Диаметр таких неоднородностей, вычисленный в приближении Гинье [6] с использованием кривой 2 по формуле $D = R_g \sqrt{20/3}$ (здесь $R_g = \sqrt{-3\Delta \ln I/\Delta q^2}$ — радиус инерции неоднородностей, а отношение $\Delta \ln I/\Delta q^2$ высчитывается для линейного участка кривой $\ln I(q^2)$ в области малых q), составляет ~ 10 nm. Практически полное отсутствие зависимости I от q для неактивированного стекла позволяет утверждать, что данные неоднородности не являются изначальным свойством матрицы, а обусловлены присутствием редкоземельных активаторов.

Что касается наблюдающегося при варьировании техники и температурно-временных условий синтеза изменения угла наклона линейного участка кривой МУРН в координатах $\ln I - q^2$, то оно естественным образом объясняется изменением размеров этих наночастиц.

Совокупность полученных экспериментальных фактов:

1) сужение полосы ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0}$ ионов Eu³⁺ в высокосимметричных сложных Ce⁴⁺–Eu³⁺-центрах Ce–Euсодержащего кварцевого гель-стекла до значений, характерных для оксидов;

2) исчезновение для этих центров электронно-колебательной компоненты перехода ${}^7F_0 \rightarrow {}^5D_2$, обусловленной колебаниями структурных элементов матрицы;

 наличие на дифрактограммах этого стекла максимумов, соответствующих решетке CeO₂, и идентичность ее структуры со структурой оксокомплексов Eu(III) в высокосимметричных сложных центрах; 4) присутствие в таком стекле нанонеоднородностей с размером ~ 10 nm позволяет однозначно утверждать, что высокосимметричные Ce⁴⁺–Eu³⁺-центры представляют собой оксидные наночастицы, в которых ионы Eu³⁺ окружены оксокомплексами Ce(IV).

Авторы выражают признательность В.И. Акимову за помощь в проведении фазового анализа.

Список литературы

- [1] Г.Е. Малашкевич, Е.Н. Подденежный, И.М. Мельниченко, А.В. Семченко. ФТТ **40**, *3*, 458 (1998).
- [2] Г.Е. Малашкевич, А.Г. Маханек, А.В. Семченко, В.Е. Гайшун, И.М. Мельниченко, Е.Н. Подденежный. ФТТ 41, 2, 229 (1999).
- [3] Г.Е. Малашкевич, Г.И. Семкова, В.Е. Гайшун, А.В. Мудрый. Письма в ЖЭТФ 74, 7, 426 (2001).
- [4] G.E. Malashkevich, E.N. Poddenezhny, I.M. Melnichenko, A.A. Boiko. J. Non-Cryst. Solids 188, 107 (1995).
- [5] K. Ibel. J. Appl. Crystallogr. 9(4), 296 (1976).
- [6] A. Guinier, G. Fournet. Small-angle scattering of X-rays. J. Willey-Champan, N. Y.–London (1955). 268 p.
- [7] Г.Е. Малашкевич, В.А. Лапина, Г.И. Семкова, П.П. Першукевич, Г.П. Шевченко. Письма в ЖЭТФ 77, 6, 341 (2003).
- [8] T. Hayakawa, M. Nogami. J. Appl. Phys. 90, 5, 2200 (2001).
- [9] А.Р. Силинь, А.Н. Трухин. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO₂. Зинатне, Рига (1985). 244 с.
- [10] M. Nogami, Y. Abe. J. Non-Cryst. Solids 197, 73 (1996).
- [11] М.С. Полуэктов, Н.П. Ефрюшина, С.А. Гава. Определение микроколичеств лантаноидов по люминесценции кристаллофосфоров. Наук. думка, Киев (1976). С. 14.
- [12] Химия и периодическая таблица / Под ред. К. Сайто. Мир, М. (1982). С. 179.
- [13] Г.О. Карапетян, Д.М. Юдин, Д.Г. Галимов. Изв. АН СССР. Сер. физ. XXXI, 5, 809 (1967)